

產業服務

半導體 SEMI S2 解決方案

UL Solutions 是半導體製程設備與廠務系統的備受信任安全科學專家，可實現測試、檢驗與認證

有助於快速取得產業與市場認可的 SEMI S2 認證

從消費性電子產品、行動載具、自駕車、AI 人工智慧、ML 機器學習、通訊、工業到雲端運算，半導體及晶片技術發展被視為是形塑未來面貌及推動許多產業創新的核心驅動力。

晶片在製程上的常見挑戰除了可包括尺寸微縮技術問題以及良率的如何優化等方面，另在繁複的生產流程中，每個環節所用到的設備機台品質、安全和可靠性，亦會顯著影響製造結果。

由全球半導體產業協會 (SEMI) 所制定的 SEMI 安全標準，正是保障半導體設備、操作人員和環境的安全，因此取得該標準的符合性認證，對半導體製造商在獲國際認可、信賴度及企業形象上更具說服性。

隨著半導體產業的蓬勃發展，全球多數科技廠已將設備符合 SEMI 安全認證納為廠務運作的驗收標準，特別是促使設備取得 SEMI S2 認證，能有助於外界確認製程與環境的安全、穩定與可靠性，並降低意外與風險。

UL Solutions 的半導體標準專家團隊可協助確認您的半導體製造設備與廠務系統符合 SEMI S2、S8 及其他 SEMI 安全指南要求，以更快贏得產業與市場的認可。

taiwan.UL.com

我們的全系列解決方案，可提供您進入市場的一站資源

UL Solutions 訓練有素且經驗豐富的半導體暨工業自動化專家團隊有助於您確定您的半導體製造設備與廠務系統符合 SEMI S2、S8 及其他 SEMI 安全指南要求，及目標市場的特定要求，以更快贏得產業與市場的認可。

我們能及時地將依您需求組合的解決方案遞交給您與您的客戶：

SEMI 系列安全標準評估

- SEMI S1：設備安全標籤安全準則
- SEMI S2：半導體製造設備的安全衛生及環保準則
- SEMI S3：製程液體加熱系統安全準則
- SEMI S6：半導體製設備排氣通風準則
- SEMI S8：半導體製造設備人因工程之安全準則
- SEMI S10：風險評估及風險估算過程之安全準則

- SEMI S13：製造設備予使用者文件之安全衛生及環境準則
- SEMI S14：半導體製造設備火災風險評估與降低之安全準則
- SEMI S22：半導體製造設備電氣安全設計準則
- SEMI F47：半導體加工設備電壓瞬降應變能力準則

北美市場適用的 UL 認證標誌

- UL 列名 (Listing) 認證
- 一次性貼標 (LPC)
- 設備的現場實地貼標 (Field Labeling)

歐洲市場適用的 CE 標示

- 機械指令
- 低電壓指令
- 電磁相容性指令

為何選擇 UL Solutions

- 術業專攻的技術團隊予以全力支持——配置在美國當地與遍及全球的專家群已緊密織成一個合作網，能夠如時交付您的專案，協助實現您的商業目標。我們在執行 NFPA 70 電氣設計、安裝與檢測標準與 NFPA 79 工業機械電氣標準符合性的現場評估與貼標等服務，擁有一群訓練有素的技術專家。
- 國際認可度與連結力——不僅與國際電器檢驗員協會 (IAEI) 保持緊密合作，我們亦在安全與 SEMI 標準的發展過程高度參與，同時在軟 / 硬體上符合國際認證標準 (IAS) 的要求，如已成為通過 ISO/IEC 17020 與 NFPA 790/791 標準的現場評估機構 (#FEB-107)。
- 安全科學的全球專家——UL 標準的成就除了立基於我們的安全科學，還來自於我們的測試經驗，以及來自產業與利益相關方的實務回饋。正因為我們對安全科學的重視，因此有信心予以產業對市場准入有更高的自信。

個案研究

隨著美國政府在近年大力倡導「美國製造業回流」政策，台灣半導體企業在基於商業考量下，遂前往美國設立工廠。然其欲在美國投入營運，按規定，除須符合美國相關法規，還需掌握更加嚴格的半導體設備及工廠環境嚴格要求。

該大廠委託的半導體設備、廠務系統與技術解決方案供應商——帆宣科技，於是找到有能力提供「NEC 認證 + SEMI 認證」整合性認證服務的 UL Solutions，依據美國國家電工法規 (NEC) 與半導體 (SEMI) 標準要求，為其建置的廠房、設備、系統與流程，完成評估與認證，取得 SEMI S2 及 NEC (NFPA 70) 雙認證，幫助該大廠順利地在美國開天闢地。

了解更多詳情：taiwan.UL.com/casestudies
聯絡我們：www.UL.com/zh-hant/contact-us#sales

快速便捷的服務流程，滿足您的上市計畫



文件 / 結構審查



實驗室執行測試



核發符合性證書



Safety. Science. Transformation.™

© 2024 UL LLC. All rights reserved.
EIA24CS1791682